

評価・解析セミナー 2024



2024

11/21(木)

会場 松本市勤労者福祉センター

時間 10:30~17:00 ※受付開始10:00~

定員 150名

参加費 無料

お申込み方法 下記お申し込みフォームからのお申込み 又は メールにてお申し込みください

締切 11月15日(金)

同時開催 同会場2Fにて「たかやまrika展示会」を開催いたします

詳細は弊社HPをご確認ください

主催:高山理化精機(株) 共催:(株)日立ハイテック
協賛:エスバック(株)/JFEテクノリサーチ(株)/(株)堀場製作所/(株)日立ハイテックサイエンス
サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)/オックスフォード・インストゥルメンツ(株)/アメテック(株)
(株)ハイロックス/(株)マイクロサポート/株式会社HIRANUMA
デモ機をご用意しておりますのでご自由にご覧いただけます

セミナー参加お申し込みフォーム▼

お問合せ
お申込み

E-Mail:seminar@takayamarika.co.jp

Fax:0263-26-8111

Tel:0263-25-3111(高山理化精機・安藤)

ご記入いただいた個人情報を下記の目的に必要な範囲でのみ使用させていただきます。
・お客様に対する展示会のご案内や各種製品情報に関するメールの配信及びマーケティング活動。
・個人が識別・特定できないように加工した資料を作成し、新製品開発などの業務遂行のために利用、
処理することを目的としたお客様の情報の収集・分析。
・共同開催企業より、お問合せさせて頂く場合があります。

プログラム

評価・解析
セミナー
2024

2024年11月21日(木) 10:30~17:00
松本市勤労者福祉センター

10:00	開場	
10:30~11:30	エスパック(株) 信頼性試験と電動化に向けた試験動向について	信頼性試験の基礎的な考え方と電動化に伴う評価におけるポイント、試験事例などご紹介いたします
11:30~13:00	昼休憩・午後の受付	会場内のデモ機・同時開催しております展示会をご自由にご覧いただけます
13:00~13:40	JFEテクノリサーチ(株) デジタル画像相関法(DIC)による変形特性、 熱ひずみ特性評価のご紹介	DICの適用による材料変形時のひずみ分布評価と電子部品における別分布評価課題についてご紹介
13:40~14:20	(株)堀場製作所 材料分析・評価事例のご紹介	顕微ラマン分析装置や蛍光X線分析装置、グロー放電発光表面分析装置などを用いた様々な材料分析・評価ソリューションのご紹介
14:20~14:50	休憩	デモ機・パネルの展示・同時開催の展示会をご覧いただけます
14:50~15:10	(株)日立ハイテク 多検体の観察作業を自動化！ SU3800SE/SU3900SEのご紹介	新型ショットキーFE-SEMの特徴とSEM/EDSアプリケーション事例
15:10~15:30	(株)日立ハイテク 品質管理における卓上顕微鏡Miniscopeの活用法	日立卓上SEM・EDSの最新情報と品質管理アプリケーションのご紹介
15:30~15:50	(株)日立ハイテク 内部構造解析におけるイオンミリングの活用	イオンミリング装置の解析事例と最新オプションのご紹介
15:50~16:10	(株)日立ハイテク 最新AFMによる自動化技術とSEM-AFM AFMリンケージ機能による AFM-AFM解析事例のご紹介	新製品AFM5500MIIによる自動測定とSEM-AFMリンケージ機能によるAFM-AFM解析事例のご紹介
16:10~16:40	(株)日立ハイテクサイエンス ハンドヘルド蛍光X線分析装置で加速する効率的な 品質管理	製造業における品質管理の現場のニーズに対し、ハンドヘルド装置であることによるメリット、寄与できるポイントなどをご紹介
16:40	閉会の挨拶	17:00までご自由にデモ機などご覧いただけます

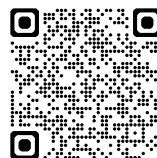
共催・協賛メーカーのデモ機をご用意しております
実機を是非ご確認ください

会場案内

【会場】松本市勤労者福祉センター

【所在地】〒390-0811
長野県松本市中央4-7-26
TEL:0263-35-6286

【交通】・松本駅から徒歩約20分
・お車でご来場の場合は、無料駐車場をご利用ください



松本市勤労者福祉センターHP